Низкотемпературная пластичность чистого параводорода

© Л.А. Алексеева, Д.Н. Казаков*

Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина Национальной академии наук Украины, 61103 Харьков, Украина

* Специализированное научное предприятие "КОРТЭК",

119361 Москва, Россия

E-mail: alekseeva@ilt.kharkov.ua

(Поступила в Редакцию 23 ноября 2006 г. В окончательной редакции 9 апреля 2007 г.)

Методом ступенчатого нагружения в условиях одноосного растяжения при температурах 1.8–4.2 К измерены кривые деформации $\sigma(\varepsilon)$ монокристаллов чистого параводорода $(p-H_2)$ (99.9999 mol.%), в котором содержание стабильного изотопа — дейтерия — было значительно понижено ([D]/[H] ~ 0.005–0.006 at.%) по сравнению с природным изотопным составом. Для понижения содержания дейтерия в параводороде впервые использовался метод кристаллизации в твердую фазу, ее последующего плавления и дистилляции полученных в результате паров. Выявлено аномальное понижение предела текучести монокристаллов с понижением температуры. Характер аномалии указывает на когерентное зонное движение дефектов (скорее всего, перегибов на дислокациях), обеспечивающих низкотемпературную пластичность исследованного чистого $p-H_2$.

PACS: 62.20.-x, 67.80.-s

1. Введение

Твердый водород представляет интерес для низкотемпературной физики пластичности и прочности прежде всего как представитель уникальной группы квантовых кристаллов (отвердевшие изотопы гелия и водорода) с чрезвычайно высокой интенсивностью нулевых решеточных колебаний [1]. Среднеквадратичное смещение образующих кристалл частиц относительно равновесных положений в решетке при температуре T = 0 К в случае Не достигает ~ 30%, а в молекулярном H₂ приближается к ~ 20% от параметра решетки. В классических кристаллах обычно такие значения нормированных амплитуд достигаются лишь вблизи точки плавления.

При обсуждении закономерностей пластической деформации квантовых кристаллов в первую очередь обращают внимание на возможность реализации в них чисто квантового (туннельного) [2,3] зарождения и перемещения на большие расстояния элементарных "носителей" пластичности — вакансий и дислокаций, тогда как классическая теория пластичности базируется на представлениях о термоактивационном характере этих процессов. При изучении данной проблемы водород обладает преимуществом по сравнению с гелием. В отличие от твердого гелия водород можно получить в виде свободно стоящих образцов и реализовать в них простые схемы однородной пластической деформации, осуществляемой перемещением микродефектов или линейных несовершенств — дислокаций — по одной системе скольжения, как того требует теория. При условии [4] высокой чистоты и совершенства кристалла квантовый характер пластичности H₂ может обнаруживаться практически во всей области существования его кристаллического состояния, поскольку величина θ_D температуры Дебая (~ 118 К) на порядок величины превосходит температуру плавления (~ 14 K) [1].

Вместе с тем некоторые специфические особенности молекулярного и решеточного строения твердого водорода существенно затрудняют физическую интерпретацию результатов деформационных экспериментов, однозначную идентификацию элементарных процессов пластичности и возможного влияния на них квантовых эффектов. Наиболее значительная особенность — существование в природе (см., например, [5]) двух спинядерных модификаций H₂ (орто-H₂ и пара-H₂, спины ядер соответственно параллельны или антипараллельны). Параводород в твердом состоянии представляет собой кристаллическую матрицу из сферически симметричных молекул p-H₂, часть узлов которой занята молекулами o-H₂.

Ортомолекулы существенно искажают¹ вокруг себя кристаллическую структуру и тем самым нарушают квантовую когерентность коллективных атомных перестроек, определяющих пластическую деформацию (движение элементов дислокационных линий, дислокационно-вакансионные процессы и т.п.). При наличии в H₂ ортомодификации его пластичность оказывается значительно пониженной, а прочность растет [6,7]. Столь же значительно влияет на протекание процессов пластической деформации твердого Н2, значительно ослабляя их квантовый характер [8,9], примесь естественного стабильного изотопа водорода — дейтерия (атомная концентрация [D]/[H] ~ 0.0147-0.0156 at.% [10]). Принципиально дейтерий в газовой и, следовательно, в твердой фазах H₂ может существовать в виде аксиальносимметричных молекул HD и D2. Роль этих молекул

¹ Молекулы p-H₂ в кристалле находятся в основном вращательном состоянии J = 0 (J — угловой момент молекулы в единицах $h/2\pi$). Плотность распределения электронного заряда в этом случае обладает сферической симметрией, поэтому парамолекулы взаимодействуют посредством лишь слабых Ван-дер-Ваальсовых сил (в отличие от ортомолекул, которые несут на себе квадрупольный момент).

как дефектов кристаллической структуры и центров торможения пластического скольжения (движения дислокаций) связана не только с их аксиально-симметричной формой, но и с большой массой. Поэтому основной задачей при исследовании пластичности водорода является получение как можно более совершенных ² монокристаллов $p-H_2$ высокой не только химической, но и изотопической чистоты.

В данной работе исследована низкотемпературная пластичность параводорода высокой чистоты (99.9999 mol.%) с содержанием $[D]/[H] \sim$ $\sim 0.005 - 0.006$ at.%. Были измерены диаграммы деформирования *p*-H₂, изучена их стадийность и определны наиболее "грубые" характеристики процесса пластического течения, представляющие основной интерес с точки зрения теории: предел текучести, его чувствительность к изменениям температуры, коэффициенты упрочнения на различных стадиях пластической деформации, пределы прочности и значения полной деформации до разрушения (резерв пластичности).

2. Методика эксперимента

Для приготовления параводорода использовался нормальный водород (n-H₂, 75 mol.% o-H₂), очищенный с помощью реактора типа СХПВ-500 (Москва) [14] в результате взаимодействия с гранулированным сорбентом, синтезированным на основе сплавов интерметаллических соединений. В режиме глубокой очистки чистота газообразного водорода на выходе реактора достигала $\sim 1 \cdot 10^{-4}$ mol.%. Содержание ортомодификации в H₂ было понижено до $\sim 0.2 \, \text{mol.\%}$ в результате длительного выдерживания *n*-H₂ при температуре кипения в конверторе в присутствии катализатора Fe(OH)₃. Отобранный из конвертора параводород перепускался через находящийся при температуре *T* = 20.4 К химический фильтр из стекловолокна с высокой избирательностью по Н2 в охлажденную гелием модифицированную ячейку криостата [15] для выращивания образцов, где он кристаллизовался в твердую фазу. Ячейка позволяла получать образцы стандартной формы для испытаний на растяжение. С учетом повышения чувствительности *p*-H₂ к тепловым ударам при повышении его чистоты была пересмотрена конструкция ячейки и обеспечены гелиевый перехват тепла, плавный режим охлаждения образцов, а также более быстрая стабилизация температуры.

Кристаллы выращивались со скоростью $\sim 0.3-0.5 \text{ mm/min}$ с применением метода кристаллизации *p*-H₂ в твердую фазу, последующего ее плавления и двойной дистилляции полученных в результате паров.

Вследствие различия парциального давления изотопов и Н₂ при отборе паров происходило естественное обеднение $p-H_2$ менее летучим (дейтерием) и обогащение основным, более летучим компонентами. Выращенные монокристаллы освобождались от стенок заключающей их ячейки посредством откачки паров над ними, отжигались при температурах вблизи точки плавления и медленно охлаждались до температуры испытания. Диаметр (3.5-5.2 mm) измерялся с помощью длиннофокусного микроскопа типа МБС-2. Образцы были проанализированы с помощью массспектрометрического и хроматографического анализов. При этом использовался метод накапливания малых проб в суммарной пробе после их вымораживания при температуре жидкого водорода, который позволил значительно увеличить точность анализа (до ±0.003%). Растяжение образцов осуществялось последовательным приращением прикладываемого к образцам напряжения равными величинами $\Delta \sigma~(\sim 2.5\,\mathrm{kPa})$ через одинаковые промежутки времени $\Delta t (\sim 2-3 \min)$ с помощью весов с чувствительностью ±200 mg. Удлинение кристаллов измерялось индуктивным датчиком перемещений [16] с точностью $\pm 10^{-5}$ cm, температура — двумя полупроводниковыми термометрами с точностью $\pm 2 \cdot 10^{-2}$ К.

3. Результаты экспериментов

При исследовании особенностей низкотемпературной пластичности p-H₂ с пониженным содержанием изотопов ([D]/[H] ~ 0.005–0.006 at.%) прежде всего досконально изучено поведение образцов при температурах 1.8–4.2 К в условиях, предполагающих их последовательное растяжение малыми догрузками и столь же плавную "разгрузку". При этом было установлено полное отсутствие на деформационных кривых гистерезиса, а также необратимый характер деформации. Это свидетельствует [13] об отсутствии в исследованных монокристаллах p-H₂ крупномасштабных планарных дефектов упаковки.

На рис. 1, *а*, *b* приведены типичные зависимости относительного удлинения ε монокристаллов исследованного *p*-H₂ от величины приложенного к ним напряжения σ . Показанные зависимости получены при температурах, соответствующих границам исследованного температурного интервала: 1.8 и 4.2 К. В процессе растяжения монокристаллов исследованного *p*-H₂ достигались предельные для конструкции криостата значения полного относительного удлинения $\sim 50\%$ без их разрушения.

После достижения этой максимально возможной величины деформации осуществлялось плавное поджатие предварительно растянутых монокристаллов с помощью обратного хода нагружающего устройства. Благодаря стеклянной конструкции криостата эта процедура позволила визуально проконтролировать обнаруживаемую при различных степенях поджатия (рис. 2, a — слабое, рис. 2, b — сильное), сохраняющуюся вплоть до температуры 1.8 К высокую пластичность и мягкость монокристаллов исследованного p-H₂.

² Вовлечение в деформационный механизм особо чистого H_2 крупномасштабных планарных дефектов [11,12], распознаваемых обычно по обратимости больших величин деформации и наличию гистерезиса на деформационных кривых [13], существенно меняет характер его пластичности и приводит к вуалированию механизмов, обеспечиваемых микродефектами, для которых более адекватным может оказаться квазичастичный подход.



Рис. 1. Типичные зависимости (a) и начальные участки зависимостей (b) относительного удлинения ε от приложенного напряжения σ для монокристаллов параводорода с пониженным содержанием дейтерия, исследованных при 1.8 (1) и 4.2 K (2). Показаны также отличающиеся высокими величинами производной $d\sigma/d\varepsilon$ кривые $\sigma(\varepsilon)$ (3) для поликристаллов p-H₂ с содержанием [D]/[H] ~ 0.1 (a) и ~ 0.04 at.% (b) при 1.8 K.

При обратном движении растягивающего штока вплоть до температуры $T = 1.8 \,\mathrm{K} \,(\sim 1.5 \cdot 10^{-2} \theta_{\mathrm{D}})$ образцы необратимо изменяли свою форму. В большой степени аналогично монокристаллам p-H₂, исследованным в работе [8], они изгибались, принимали форму петли, что хорошо фиксировалось при визуальном наблюдении. На рис. 1, b кривые $\sigma(\varepsilon)$ представлены в более тонком масштабе с ограничением по оси абсцисс достигнутных величин деформации. Поскольку параводород кристаллизуется с образованием гексагональной плотноупакованной кристаллической структуры [1] с присущей ему анизотропией пластических свойств [8,14], на рис. 1 показаны кривые $\sigma(\varepsilon)$, которые соответствуют "выборке" из сравнительно большого числа (~ 7-9 для каждого из указанных значений температуры) измеренных кривых. Они отвечают, скорее всего, наиболее благоприятной ориентировке базисной плоскости монокристаллов относительно оси растяжения. Эти кривые $\sigma(\varepsilon)$ характеризуются наименьшими величинами деформирующих напряжений, требующихся для достижения одинаковой степени деформации образцов. Для сравнения на рис. 1, *a*, *b* показаны также типичные кривые $\sigma(\varepsilon)$, измеренные в аналогичной схеме растяжения, для *p*-H₂ (~0.2 mol.% *o*-H₂), выращенного в виде поликристаллов (размер зерен ~ 1.5 mm) с содержанием [D]/[H] ~ 0.1 at.% (рис. 1, *a*) и [D]/[H] ~ 0.04 at.% (рис. 1, *b*).

Анализ полученных кривых $\sigma(\varepsilon)$ в логарифмических координатах показал, что они аппроксимируются степенной функцией $\sigma \sim \varepsilon^n$. При этом на полученных зависимостях $\sigma(\varepsilon)$ можно выделить две стадии. На первой из них величина n₁ близка к единице (в случае монокристаллов $n_1 \sim 0.7 - 0.8$). С началом второй стадии величина показателя упрочнения резко падает до значения $n_2 \sim 0.2 - 0.3$. Резкое изменение величины показателя степени *п* происходит при критических значениях напряжения σ_0 и деформации ε_0 . Определенные по пересечению прямых, образовавшихся в результате перестроения первоначальных зависимостей $\sigma(\varepsilon)$ в логарифмические координаты, значения ε_0 для монокристаллов, например, оказались равны 7.73 и 10.97% для температур 4.2 и 1.8 К соответственно. Величины σ_0 при этом слабо понижаются от значения $\sigma_0 \approx 13.62 \,\mathrm{kPa}$ до значения $\sigma_0 \approx 13.23 \,\mathrm{kPa.}$ В случае поликристаллов *p*-H₂ переход от одной стадии к другой происходит при значительно более низких величинах ε_0 и высоких напряжениях σ_0 . Например, для *p*-H₂ с содержанием $[D]/[H] \sim 0.1$ at.% переход от стадии с $n_1 \approx 1$ к стадии с низким пока-



Рис. 2. Типичный вид предварительно растянутых при температуре T = 1.8 К монокристаллов параводорода с пониженным до $[D]/[H] \sim 0.005-0.006$ at.% содержанием дейтерия, полученный на стадиях с различной степенью их поджатия (a — слабое, b — сильное) при обратном ходе нагружающего штока (T = 1.8 K).

зателем степени упрочнения $n_2 \approx 0.2$ происходит при значениях σ_0 и ε_0 , равных соответственно 22.74 kPa и 0.56%, что близко к характерным для поликристаллов $n-\text{H}_2$ [17] вблизи точки плавления (при $T \ge 12$ K).

На вторых стадиях кривых $\sigma(\varepsilon)$ величины коэффициента упрочнения $\vartheta = d\sigma/d\varepsilon$ для монокристаллов достигают постоянного значения и остаются неизменными вплоть до предельно достижимой величины деформации. Вторая стадия их деформирования характеризуется чрезвычайно низкой величиной ϑ . Для температур 4.2 и 1.8 К нормированные на модуль сдвига твердого p-H₂ [1] значения "приведенных" коэффициентов упрочнения ϑ^* оказываются в точности равны $3 \cdot 10^{-5}$ и $2.5 \cdot 10^{-5}$ соответственно.

Из приведенных на рис. 1 кривых видно, что зависимости $\sigma(\varepsilon)$ для монокристаллов исследованного *p*-H₂, полученные при разных температурах, расположены друг относительно друга необычным с точки зрения классических представлений образом — для получения заданной степени деформации $\varepsilon = \text{const}$ твердого *p*-H₂ при более низкой температуре требуются более низкие напряжения, чем при более высокой температуре. Аномальный характер температурного влияния следует также из анализа критического напряжения σ_T , определяемого графической экстраполяцией (рис. 1, b) вторых стадий кривых $\sigma(\varepsilon)$ с характерными для них неменяющимися коэффициентами упрочнения к нулевому уровню деформации. Величина σ_T соответствует классическому определению "предела текучести" ГПУ-монокристаллов и определяет их переход к стадии развитого пластического течения (см., например, [18]). Оказалось, что в случае исследованного $p-H_2$ величины σ_T достаточно близки к определенным в логарифмических координатах значениям σ_0 : значения σ_T равны 14.26 и 11.43 kPa для температур 4.2 и 1.8 К соответственно. Видно, что эти величины еще более заметно, чем величины σ_0 , уменьшаются с понижением температуры. Учитывая условность определений, можно заключить, следовательно, что принципиально обе измеренные величины являются надежными аналогами истинного предела текучести *p*-H₂ и величина его в случае чистого *p*-H₂ явно уменьшается с понижением температуры.

Обсуждение результатов экспериментов

Полученные кривые деформации исследованного p-H₂ по своему виду в точности соответствуют типичным кривым деформации выращенных в виде монокристаллов веществ с гексагональной плотноупакованной структурой (см., например, [18]), в том числе монокристаллов ГПУ-p-H₂ [8,14]. Предельно низкие величины коэффициентов упрочнения для их вторых стадий характерны для развитого пластического течения, обеспечиваемого перемещением дислокаций в какой-либо одной кристаллографической плоскости [18,19]. Необратимый характер растяжения монокристаллов исследованного

p-H₂ (рис. 2) и отсутствие на измеренных в циклах "нагрузка–разгрузка" кривых $\sigma(\varepsilon)$ гистерезиса явно указывают [13] на то, что процесс его деформации обеспечивается не крупномасштабными планарными дефектами, а линейными несовершенствами кристаллической решетки — дислокациями. При этом подвижность дислокаций в решетке должна быть существенно ограничена существующими в ней потенциальными барьерами. При низких температурах и напряжениях эти барьеры могут преодолеваться только с участием термических (см., например, [19]) или квантовых флуктуаций, а также посредством туннелирования, вероятность которого экстремально возрастает для легких дефектов [2,3].

Из приведенных результатов следует, что измеренные двумя различными способами величины критического напряжения перехода монокристаллов исследованного p-H₂ к развитому пластическому течению для более низкой температуры заметно ниже значений, регистрируемых для более высокой температуры. Можно заключить, таким образом, что для истинного предела текучести исследованного p-H₂ имеет место неравенство $\sigma_T^*(4.2 \text{ K}) > \sigma_T^*(1.8 \text{ K}).$

Если величины деформирующих напряжений (в том числе предела текучести) определяются вероятностью преодоления дислокациями препятствующих барьеров, выполнение неравенства $\sigma_T^*(4.2 \text{ K}) > \sigma_T^*(1.8 \text{ K})$ является достаточным признаком, позволяющим приписать их подвижности в исследованном *p*-H₂ квантовый характер. На основании полученного неравенства можно сделать вывод, что вклад квантовых туннельных механизмов (включая когерентное, зонное движение обеспечивающих деформацию микродефектов) явно превалирует в исследованном *p*-H₂ над классическими процессами термоактивационной природы. Такой же вывод был сделан при исследовании ползучести чистого *p*-H₂ как в режиме его низкотемпературного крипа [8], так и при изучении характера деформации неустановившейся ползучести [20] под действием постоянно приложенного напряжения.

Для оценки стопорящей силы энергетических барьеров, создаваемых присутствующими молекулами примесей, может быть использована амплитуда U₀ взаимодействия "примесь-дислокация". При этом становится очевидной также роль термических или квантовых флуктуаций в процессах преодоления дислокациями связанных с примесью барьеров. Для краевой дислокации, взаимодействующей в матрицах n-H2 и p-H2 с уединенными примесными молекулами дейтерия (D₂) и дейтероводорода (HD), величины U₀ вычислены в работе [21]. В случае *p*-H₂ энергии U₀ равны соответственно 9.04 и 4.45 К. При рассмотрении взаимодействия дислокаций в твердом параводороде с аксиальными ортоквадруполями следует учесть, что ортопримесь находится при гелиевых температурах в кристалле *p*-H₂, как правило, не в виде матрично-изолированных молекул. Для малых значений ортоконцентрации (в том числе для ее значения c = 0.2 mol.%, например), в образцах p-H₂

образуется в основном связанный парный дефект (см. работу [1] и ссылки в ней). Их количество определяется квадратом концентрации, т.е. $\sim 4 \cdot 10^{-6}$. С учетом [22] число радикально взаимодействующих с дислокациями парных ортокластеров меньше примерно вдвое. Если движение дислокаций в *p*-H₂ связано с активированной переориентацией ортоквадруполей, в качестве энергии активации будет выступать характерная энергия электростатического квадруполь-квадрупольного взаимодействия двух соседних молекул о-Н2, равная 3.2 К [1]. Учитывая "вымораживание" фононов (плотность которых пропорциональна $(T/\theta_D)^3$, см., например, [1]), преодоление дислокациями примесных барьеров в *p*-H₂ при исследованных низких по сравнению с дебаевской температурах может осуществляться с участием в их кинетике квантовых флуктуаций.

Выяснение относительного влияния туннельных эффектов на подвижность дислокаций в рельефе Пайерлса для системы легкого скольжения, действующей в условиях низкотемпературного деформирования кристалла, должно основываться на оценке величины σ_p пайерлсовского напряжения. Вычисленная для кристаллического H₂ без учета квантово-кристаллических нормировок величина σ_p принимает значения ~ 314–392 kPa [21]. В области реализованных при растяжении монокристаллов исследованного p-H₂ низких напряжений для движения дислокаций в пайерлсовском рельефе его кристаллической решетки имеет место несомненное влияние квантовых туннельных эффектов.

Таким образом, наблюдающиеся особенности низкотемпературной пластичности исследованного p-H₂ в области температур 1.8—4.2 К полностью обусловлены, скорее всего, особенностями когерентного зонного перемещения перегибов на дислокациях в пайерлсовском рельефе [23,24] кристаллической решетки, модулированном остаточной примесью ортомолекул и дейтерия. В исследованном p-H₂ дейтерий должен находиться при этом в виде молекул дейтероводорода (HD) [9].

5. Заключение

Исследована низкотемпературная пластичность монокристаллов *p*-H₂ со значительно пониженным по сравнению с природным отношением атомов дейтерия к атомам водорода $([D]/[H] \sim 0.005 - 0.006 \text{ at.}\%)$. Образцы выращены с использованием нового метода кристаллизации *p*-H₂ в твердую фазу, последующего ее плавления и двойной дистилляции полученных в результате паров. Обнаружено аномальное понижение с уменьшением температуры предела текучести и коэффициента упрочнения на стадии развитого пластического течения необратимо деформирующихся образцов (см. также [25]). Наблюдаемая температурная аномалия свидетельствует о когерентном зонном характере движения в рельефе Пайерлса перегибов на дислокациях [23], осуществляемого, скорее всего, во вторичном рельефе Пайерлса [24].

Авторы благодарят В.Г. Манжелия, М.А. Стржемечного, А.И. Прохватилова, В.Д. Нацика и К.А. Чишко за обсуждение результатов экспериментов и полезные замечания, Л.А. Ващенко и Т.Ф. Лемзякову за первоначальный хроматографических анализ водорода, а также А. Кузнецова за помощь в экспериментах.

Список литературы

- Physics of Cryocrystals / Eds V.G. Manzhelii, Yu.A. Freiman, M.L. Klein, A.A. Maradudin. AIP PRESS, Woodbury, N.Y. (1996); В.Г. Манжелий, М.А. Стржемечный. Квантовые молекулярные кристаллы. В кн.: Криокристаллы / Под ред. Б.И. Веркина, А.Ф. Прихотько. Наук. думка, Киев (1983).
- [2] А.Ф. Андреев, И.М. Лифшиц. ЖЭТФ 56, 2057 (1969).
- [3] А.Ф. Андреев. УФН 118, 251 (1976).
- [4] М.Ю. Каган, Л.А. Максимов. ЖЭТФ 84, 792 (1983).
- [5] А. Фаркас. Ортоводород, параводород и тяжелый водород. ОНТИ, М. (1936). 244 с.
- [6] Ю.Е. Стеценко, Д.Н. Большуткин, Л.А. Индан. ФТТ 12, 3636 (1970).
- [7] И.Н. Крупский, А.В. Леонтьева, Л.А. Индан, О.В. Евдокимова. Письма в ЖЭТФ 24, 297 (1976).
- [8] Л.А. Алексеева, И.Н. Крупский. ФНТ 10, 327 (1984).
- [9] Л.А. Алексеева, Е.С. Сыркин, Л.А. Ващенко. ФТТ 45, 1024 (2003).
- [10] Б.М. Андреев, Я.Д. Зельвинский, С.Г. Катальников. Тяжелые изотопы водорода в ядерной технике. Энергоатомиздат, М. (1987). 456 с.
- [11] А.Н. Александровский, Е.А. Кирьянова, В.Г. Манжелий, А.В. Солдатов, А.М. Толкачев. ФНТ 13, 1095 (1987).
- [12] Л.А. Алексеева, В.Д. Нацик, Б.А. Халин, А.В. Пустовалова. ФНТ 14, 1127 (1988).
- [13] В.С. Бойко, Р.И. Гарбер, А.М. Косевич. Обратимая пластичность кристаллов. Наука, М. (1991). 280 с.
- [14] Л.А. Алексеева, Л.А. Ващенко, Д.Н. Казаков, В.В. Кароник, О.В. Николаева. Препринт № 30-89. ФТИНТ АН УССР, Харьков (1989). 11 с.
- [15] И.Н. Крупский, А.В. Леонтьева, Л.А. Индан, О.В. Евдокимова. ФНТ 3, 933 (1977).
- [16] Л.И. Даниленко, М.В. Зиновьев, В.А. Коваль. ПТЭ 2, 212 (1973).
- [17] Л.А. Алексеева, О.В. Литвин, И.Н. Крупский. ФНТ 8, 211 (1982).
- [18] Д.А. Вигли. Механические свойства металлов при низких температурах. Мир, М. (1974). 376 с.
- [19] Ж. Фридель. Дислокации. Мир, М. (1967). 644 с.
- [20] Л.А. Алексеева, А.В. Пустовалова, В.И. Хатунцев, Ю.В. Бутенко. ФНТ **28**, 79 (2002).
- [21] Л.А. Алексеева, М.А. Стржемечный, Ю.В. Бутенко. ФНТ 23, 448 (1997).
- [22] С.Е. Кальной, М.А. Стржемечный. ФНТ 11, 803 (1985).
- [23] Б.В. Петухов, В.Л. Покровский. ЖЭТФ 63, 634 (1972).
- [24] М.А. Стржемечный. ФНТ 10, 663 (1984).
- [25] L.A. Alekseeva. ФНТ **33**, в печати (2007).